



X線マイクロビームを用いた電線絶縁材料 の微小部分析とイメージング

日立電線(株) 高分子材料研究部 山崎孝則 安部淳一 (株)日立製作所 基礎研究所 平井康晴



はじめに





・水トリーの発生・進行メカニズムの解明が必要



絶縁体:架橋ポリエチレン(XLPE)

架橋ポリエチレン:温度上昇に伴う流動防止,架橋構造形成(三次元化)



水トリーの模擬試料と分析方法

3

HITACHI

模擬試料



方 法

- 水トリーの構造と組成を分析 (SPring 8)
- ・ 異物(イオン)の拡散状態
 : X線分光顕微法
- ・ 架橋ポリエチレンの結晶状態 : X線回折



産業用専用ビームラインでの測定

4 HITACHI







5 HITACHI





6



水トリーの光学顕微鏡写真



CaCO₃





8 нітасні

BTT: **ホ^{*} ウタイ状水トリー**



FeとCaを含む異物から発生したBTT



水トリーの成長に及ぼす要因

9

HITACHI





XLPEのX線回折の測定

10 нітасні



分析条件: ·光子エネルギー: 7 keV, ·ビーム形状: 100 µ m × 100 µ m ·0.2 ° /40secで2 スキャン



X線回折強度の変化





得られた結果



水トリーの進展推定機構





まとめ



ケーブル絶縁材料中に発生した水トリーを分析し、 次の結果を得た。

- (1) 水トリーの羽根の部分は,結晶部分に欠陥ができ、 均一性を喪失していることが分かった。
- (2) 水トリーの核を起点に異物成分の拡散状況をイメージングすることができた。
- (3) 金属異物と電解質異物では、元素の拡散状態が異なる。
- (4) イオン化し易い異物ほど拡散が大きく、水トリーへの 影響が大きい。